УДК 621.317

 ¹З.Ю. Готра, ²Дж. Тейт, ³Р. Кікінеші, ¹З.А. Дутчак, ²А.А. Закутаєв,
¹Л.М. Ракобовчук, ²Б.М. Яворський
¹Національний університет "Львівська політехніка", кафедра електронних приладів,
²Державний університет штату Орегон, (США), кафедра фізики,
³Державний університет штату Орегон, (США), кафедра матеріалознавства

СТРУКТУРА ТА ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРОЗОРИХ ЕЛЕКТРОПРОВІДНИХ ПЛІВОК НА ОСНОВІ BaCuTeF

© Готра З.Ю., Тейт Дж., Кікінеші Р., Дутчак З.А., Закутаєв А.А., Ракобовчук Л.М., Яворський Б.М., 2007

> Z. Hotra, J. Tate, R. Kykyneshi, Z. Dutchak, A. Zakutaev, L. Rakobovchuk, B. Yavorsky

STRUCTURE AND OPTICAL PROPETIES OF TRANSPARENT CONDUCTING BaCuTeF FILMS

© Hotra Z., Tate J., Kykyneshi R., Dutchak Z., Zakutaev A., Rakobovchuk I., Yavorsky B., 2007

> Методом імпульсного лазерного напилення отримано плівки BaCuTeF. Досліджено вплив температури відпалу на їхні структуру та оптичні властивості. У результаті досліджень показано можливість застосування BaCuTeF для отримання високоякісних прозорих електропровідних плівок р-типу.

> BaCuTeF films were prepared by the pulsed laser deposition method. The influence of the annealing temperature on the structure and optical properties was investigated. As a result of this research the possible application of BaCuTeF for creating high-quality transparent conducting p-type thin films was shown.

Вступ

Усі матеріали, які є водночас оптично прозорими у видимому діапазоні спектра та достатньо електропровідні, можна поділити на три основні категорії: чисті дуже тонкі метали; високолеговані органічні полімери; леговані до виродження оксиди та халькогеніди з великою шириною забороненої зони [1]. Можливі застосування прозорих електропровідних матеріалів можна також розділити на: пасивні: енергоощадні вікна (основні матеріали для цієї технології – SnO₂, TiN, SnO₂ легований F); напівактивні: електроди для плоских дисплеїв, колекторні електроди сонячних елементів, електроди на вікнах літаків та автомобілів для розмороження (основні матеріали для цих технологій – ZnO, In_2O_3 легований Sn, SnO₂ легований F) [2]; активні: прозорі діоди та транзистори (основні матеріали –ZnO, Zn₂Sn₂O₅, In₂O₃ легований Sn) [3] Усі перелічені матеріали активно використовуються і є напівпровідних матеріалів р-типу та покращання їхніх характеристик. Це відкриває можливості для створення нової галузі – прозорої електроніки.

Донедавна у літературі можна було знайти дуже невелику кількість робіт пов'язаних із розробленням методів отримання нових прозорих напівпровідників р-типу. Проте за останні декілька років ситуація істотно змінилася. Було отримано та досліджено плівки таких матеріалів, як, наприклад, $CuAlO_2$, $CuSrO_2$ [4, 5], ZnO легований Ni або Ga [6, 7]. Для отримання таких плівок сьогодні найчастіше використовують такі методи, як радіочастотне магнетронне напилення, електронно-променеве напилення та імпульсне лазерне напилення.

Методика отримання плівок

Тонкі прозорі електропровідні плівки р-типу BaCuTeF отримували за допомогою методу імпульсного лазерного напилення із подальшим відпалом. Метод лазерного напилення вибирали з міркувань можливості стехіометричного розпилення матеріалу[8].

Кристалічна гратка матеріалу BaCuTeF, як і інших матеріалів групи BaCuQF(Q = S, Se,Te), складається із послідовно розміщених шарів BaF і CuTe [9]. Відповідно як мішені використовували пресований порошок, який складався із BaF₂ прозорого діелектрика та Cu_xTe_{1-x} – металу.

Плівки BaCuTeF наносились на полікристалічну кварцову підкладку розміром 3х3см. Перед напиленням підкладка проходила триступеневе очищення в ультразвуковій ванні. Для очищення використовували ацетон, метанол та деіонізовану воду. Крім того, після встановлення підкладки у вакуумну камеру її відпалювали при температурі 300 °C для десорбції атмосферних газів, що могли знаходитися у поверхневому шарі полікристалічного кварцу. Для розпилення матеріалу мішені використовувався ексимерний KrF лазер із довжиною хвилі 248 нм. Густина потоку лазерного випромінювання на поверхні мішені під час напилення становила 1 Дж/см². Для запобігання локальному перегріву і забезпечення рівномірності товщини плівки мішень, як і підкладка, оберталися. Плівка була напилена у вакуумі із залишковим тиском 10⁻⁶ Тор при відстані від мішені до підкладки 6 см. Для забезпечення необхідної товщини та рівномірності плівки напилення проводилось з частотою лазерних імпульсів 7 Гц протягом 238 хв. Напилення проводилося на підкладку при кімнатній температурі.

Внаслідок напилення було отримано тонку напівпрозору аморфну плівку зі слабким зеленувато-жовтуватим відтінком. Після цього підкладка з плівкою були розділені на 6 частин для проведення термічного відпалу і дослідження залежностей властивостей плівки від температури.

Методика структурних та оптичних досліджень

Для отримання кристалічної структури проводили відпал на установці для швидкого термічного відпалу в атмосфері аргону. Відпал було проведено при температурах 300, 400, 500, 550, 600 і 700 °C. Тривалість процесу відпалу становила 10 хв з попередньою прокачкою аргону при кімнатній температурі протягом 10 хв. і поступовим охолодженням після відпалу.

Товщина отриманих плівок була виміряна за допомогою профілометра.

Рентгеноструктурні дослідження проводилися на апараті D-5000. Як джерело рентгенівського

випромінювання використовували трубку з мідним анодом СиК α з довжиною хвилі λ =1,54 A. Реєстрація дифракційної картини проводилась в області кутів 2 θ = 20⁰ – 60⁰.

Поверхню отриманих після відпалу плівок досліджували на атомному силовому мікроскопі.

Оптичні властивості плівок було досліджено за допомогою спектрометра із подвійним монохроматором і кремнієвим детектором. Плівки опромінювалися стабілізованою галогеновою лампою. Спектральні залежності коефіцієнтів пропускання та відбивання були зняті в діапазоні довжин хвиль 300–900 нм.

Результати експерименту та їх обговорення

Внаслідок відпалу плівки візуально незначно змінили свій вигляд – стали прозорішими і світлішими. Товщина плівок, які оброблялися при температурі меншій від 550°С, становила приблизно 150 нм і майже не залежала від температури. А для плівок, відпал яких проводився при вищих температурах, товщина різко зменшилася до 90–100 нм.

Як видно з рентгеноструктурних даних (рис. 1), плівки BaCuTeF, отримані при температурі відпалу 500°С, мають полікристалічну структуру на відміну від аморфної структури плівок, яка була отримана після напилення. При збільшенні температури відпалу до 550°С дифрактограма різко змінюється. Порівняно із 500°С зменшується інтенсивність піків, що відповідають фазі BaCuTeF. Наявність різкого піку при 27° вказує на присутність у структурі плівки кристалів BaF₂.



Рис. 1. Дифрактограми плівок: 1 – ВаСиТеF (теоретичні дані [10]); 2 – ВаF₂ (теоретичні дані); 3 – ВаСиТеF, відпалених при температурі 500 °С; 4 – ВаСиТеF, відпалених при температурі 550 °С

Аналізуючи зображення плівок, отриманих за допомогою атомного силового мікроскопу (рис. 2 а, б), можна помітити наявність кристалів розміром ~100 нм. Отже, структура поверхні плівок, відпалених при 500°С, є дійсно полікристалічною. Цей факт підтверджує висновки, зроблені з рентгеноструктурного аналізу



Рис. 2. Мікрофотографії, отримані за допомогою атомного силового мікроскопу: а – площа сканування 10 мкм²; б – площа сканування 1 мкм²

Як показник прозорості плівок використовувався нормалізований коефіцієнт пропускання T_n із врахуванням втрат на відбивання. Він був розрахований за формулою T_n=T/(1-R), де T – коефіцієнт пропускання, R – коефіцієнт відбивання.



Рис. 3. Спектральні залежності нормалізованого коефіцієнта пропускання із врахуванням втрат на відбивання для плівок BaCuTeF, відпалених при різних температурах (°C)

Як видно з рис. 3, прозорість у діапазоні 450–800 нм для плівок, відпалених при температурах, менших за 550° С, знаходиться у межах 70–80%. Для плівок, відпалених при температурах 550° С і вище, прозорість є нижчою і знаходиться у межах 50–55% (рис. 3). Прозорість, можна припустити, зменшується за рахунок збільшення поглинання внаслідок утворення більш впорядкованих полікристалічних фаз, BaF₂ і Cu_xTe_{1-x}, у структурі BaCuTeF. Як відомо, Cu_xTe_{1-x} – метал. Це і є причиною збільшення поглинання. Крім того, внаслідок комп'ютерного аналізу отриманих даних, наведених на рис. 3, можна зробити висновок, що коефіцієнт заломлення плівок становить ~2,3 і в середньому мало залежить від довжини хвилі у видимому діапазоні.

Висновок

Методом імпульсного лазерного напилення отримані аморфні плівки BaCuTeF. Досліджено вплив температури відпалу на структуру та оптичні властивості плівок. У результаті рентгеноструктурних та спектроскопічних досліджень було виявлено:

1. При температурах відпалу від 300°С до 500°С плівки ВаСиТеF покращують свої структурні та оптичні властивості – стають полікристалічними і прозорішими.

2. Показник заломлення плівок BaCuTeF, відпалених при температурах від 300°С до 700°С, мало залежить від довжини хвилі у видимому діапазоні.

3. Прозорість у діапазоні 450–800 нм для плівок BaCuTeF, відпалених при температурах, менших за 500° C, лежить у межах 70–80%. Підвищення температури відпалу до 550° C і вище зменшує прозорість за рахунок утворення більш впорядкованих полікристалічних фаз BaF₂ і Cu_xTe_{1-x}, які безумовно впливають на оптичні властивості плівок.

Отже, можна зробити висновок, що отримані методом імпульсного лазерного напилення плівки BaCuTeF із подальшим відпалом у атмосфері аргону при температурах $300-500^{0}$ C мають полікристалічну структуру, достатньо високу прозорість і можуть бути використані як високоякісні прозорі електропровідні плівки р-типу.

1. David C. Paine, Hyo-Young Yeom, Burag Yaglioglu. Transpsrent conducting oxide materials and technology. – Flexible Flat Panel Displays. – John Wiley & Sons,Ltd. – 2005. – P. 79–98. 2. Roy G.

Gordon. // MRS Bulletin. – 2000. – 8. – P. 52–57 3. Norris B. J., Wager J. F. // Applied Physics Letters. – 2003. – 82. – P. 733–735. 4. Kawazoe H.// Kotai Butsuri. – 1998. – 33. – P. 937. 5. Kawazoe H. // Tomei Dodenmaku no Shintenkai. – 1999. – P. 47. 6.. Yamamoto T., Katayama-Yoshida H. // Jap. J. Appl. Phys. – 1999. – 38. – P. L166. 7. Katayama – Yoshida H., Nishimatsu T., Yamamoto T., Orita N. // Materia. – 1999. – 38 – P. 134. 8. McLaughlin M., Sakeek H. F., Maguire P. // Appl. Phys. Lett. – 1993. – 14. – P. 1865. 9. Yanagi H., Tate J. // Appl. Phys. Lett.. – 2003. – 82. – P. 2814. 10. Park C., Kykyneshi R., Tate J., Keszler D. // J. Solid State Chem. – 2007 – in press.

УДК 546:548.736

О.І. Заремба, Р.Є. Гладишевський

Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра неорганічної хімії

ВПЛИВ ЧАСТКОВИХ ЗАМІЩЕНЬ КОМПОНЕНТІВ НА КРИСТАЛІЧНУ СТРУКТУРУ СПОЛУК СЕРІЇ *M*₂Cu₂O₃-CuO₂

© Заремба О.І., Гладишевський Р.Є., 2007

O.I. Zaremba, R.E. Gladyshevskii

THE INFLUENCE OF PARTIAL SUBSTITUTION ON THE CRYSTAL STRUCTURE OF THE *M*₂CU₂O₃-CUO₂ SERIES COMPOUNDS

© Zaremba O.I., Gladyshevskii R.E., 2007

Синтезовано шаруваті купрати серії (Ca,Sr)₂Cu₂O₃-CuO₂ з частковим заміщенням Ca та Sr на Gd, Dy, Er або Yb(Y). Методом рентгенівського дифракційного аналізу полікристалічних зразків виявлено, що розчинність рідкісноземельних металів у сполуці (Ca₆Sr₈)Cu₂₄O₄₁ є обмеженою (до вмісту 2–4 атоми на формульну одиницю), як і Sb, Sn, In, Ge та Ga (до вмісту 0,24 атома на формульну одиницю). У структурі сполуки (Ca₆Sr₈)Cu₂₄O₄₁ атоми Cu можна замістити на атоми Ni до складу (Ca₆Sr₈)Cu₂₃Ni₁O₄₁, тоді як при заміщенні на Co граничним є склад (Ca₆Sr₈)Cu₁₈Co₆O₄₁, при якому спостерігається ущільнення атомних шарів у структурі та видовження ланцюгів квадратів CuO₄.

The layered cuprates of $(Ca,Sr)_2Cu_2O_3$ -CuO₂ series with partial substitution of Ca and Sr by Gd, Dy, Er or Yb(Y) were obtained. X-ray powder diffraction analysis indicated that solubility of rare-earth metals in $(Ca_6Sr_8)Cu_{24}O_{41}$ compound is limited (up to 2-4 atoms per unit cell), as well as Sb, Sn, In, Ge and Ga (up to 0,24 atom per unit cell). The Cu atoms in the structure of $(Ca_6Sr_8)Cu_{24}O_{41}$ compound can be replaced by Ni atoms up to composition $(Ca_6Sr_8)Cu_{23}Ni_1O_{41}$, whereas at substitution by Co the limited composition is $(Ca_6Sr_8)Cu_{18}Co_6O_{41}$, where the compression of the atomic layers and extension of chains of CuO₄ squares take place.

Вступ

Сполуки гомологічної серії M_2 Cu₂O₃-CuO₂ є складними оксидами із структурами, спорідненими до структур високотемпературних надпровідників. Після відкриття першого представника цієї серії у 1988 році [1] і до сьогодні ці сполуки розглядають як перспективні надпровідники. Їхні